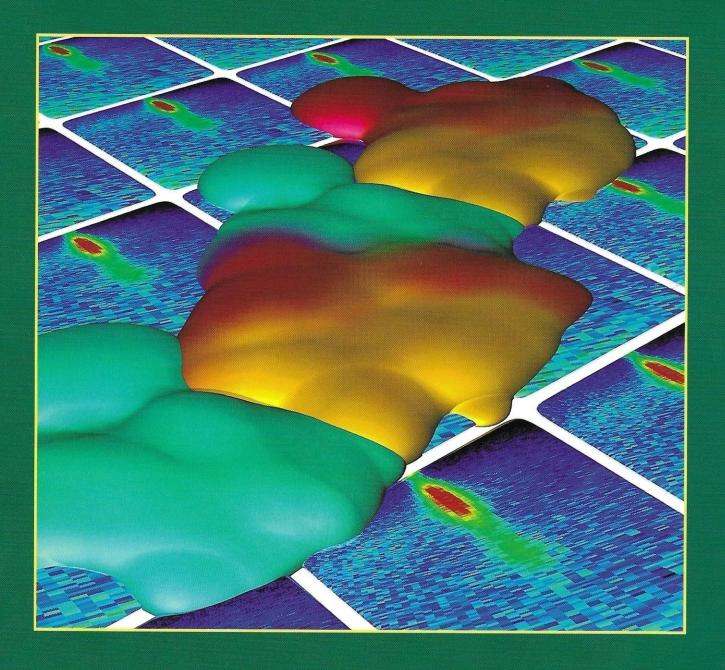


# NOTIZIARIO Neutroni e Luce di Sincrotrone





# NOTIZIARIO Neutroni e Luce di Sincrotrone

# Rivista del Consiglio Nazionale delle Ricerche

#### Cover photo:

The lower thick polystyrene layer is tiled with the two-dimensional neutron scattering pattern exhibited by the thin fuilm of poly(methyl-methacrylate) lying on top of it. The Bragg peaks, the result of interference between the front and back of the top film, are clearly visible. The van der Waals forces across the film tends to destabilise the system, resulting in spinoidal dewetting which manifests itself as a pattering of the film surface (data taken with the SURF Reflectometer at ISIS, courtesy of ISIS facility).



## Il NOTIZIARIO è pubblicato a

cura del C.N.R. in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Vol. 5 n. 1 Giugno 2000 Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 124/96 del 22-03-96

DIRETTORE RESPONSABILE:

C. Andreani

M. Apice, P. Bosi

COMITATO DI REDAZIONE:

L. Avaldi, F. Boscherini,

F. Carsughi, U. Wanderlingh

SEGRETERIA DI REDAZIONE:

D. Catena

HANNO COLLABORATO

A QUESTO NUMERO:

G. Chiarotti, A. Paoletti,

E. Rimini, F. Sette, A. Stella

GRAFICA E STAMPA:

om grafica

via Fabrizio Luscino 73 00174 Roma

Finito di stampare nel mese di Giugno 2000

PER NUMERI ARRETRATI:

Paola Bosi, Tel: +39 6 49932468 Fax: +39 6 49932456 E-mail: p.bosi@dcas.cnr.it.

PER INFORMAZIONI EDITORIALI:

Desy Catena, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Dip. di Fisica via della Ricerca Scientifica, 1 00133 Roma

Tel: +39 6 72594364 Fax: +39 6 2023507

E-mail: catenadesy@roma2.infn.it

# SOMMARIO

EDITORIALE  C. Andreani	2
RASSEGNA SCIENTIFICA	
Insight into Biosciences from Synchrotron Radiation  A. Congiu Castellano	3
Neutron Diffraction for Residual Stress  Measurements: Applications to Materials and  Components for Automotive Technology  F. Fiori	0
Critical Behaviour of a Fluid Mixture Confined in a Porous Glass Investigated Through SANS	6
Nano-Scale Spectroscopy and its Applications to Semiconductors 2 S. Heun and G. Salviati	3
Chain Deformation in Unfilled and Filled Polymer networks: a SAS Approach W. Pyckhout-Hintzen et al.	4
Stress-Texture Studies in Thin Films and Coatings by Synchrotron Radiation XRD and Neutron Diffraction 4  P. Scardi	Î
VARIE	2
SCUOLE E CONVEGNI	2
CALENDARIO 75	;
SCADENZE	<u>,</u>
ACILITIES	,





# V Scuola di Spettroscopia Neutronica "Francesco Paolo Ricci"

#### Diffusione Anelastica dei Neutroni

Hotel Capo d'Orso - Località Cala Capra - Palau (SS) 23 settembre - 3 ottobre 2000

Generalità sullo scattering dei Neutroni
Sorgenti e strumentazione
Diffusione anelastica coerente: eccitazioni collettive
Diffusione anelastica incoerente: spettroscopia vibrazionale
Diffusione quasielastica: moti diffusivi
Distribuzione di impulso nei sistemi classici e quantistici
Dinamica microscopica dei liquidi
Dinamica dei sistemi macromolecolari
Spettroscopia di tunneling
Applicazioni a: biologia, chimica, materiali

- A. Albinati, Università di Milano
- C. Andreani, Università di Roma "Tor Vergata"
- U. Bafile, Istituto di Elettronica Quantistica, CNR, Firenze
- U. Balucani, Istituto di Elettronica Quantistica, CNR, Firenze
- M. Bée, Università "J. Fourier", Grenoble
- R. Caciuffo, Università di Ancona
- C.J. Carlile, ILL, Grenoble
- D. Colognesi, CNR-ISIS, Chilton, U.K.
- M.T. Di Bari, UdR-INFM, Parma
- B. Dorner, ILL, Grenoble
- J. Eckert, Los Alamos, USA
- A. Paciaroni, OGG-INFM, Grenoble
- C. Petrillo, Politecnico di Milano
- F. Sacchetti, Università di Perugia
- U. Wanderlingh, Università di Messina

Il costo di partecipazione di Lit. 1.300.000 dà diritto alla frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche ed alla pensione completa presso l'Hotel Capo d'Orso (www.delphina.it/orso.htm) per tutta la durata della Scuola.

#### **SCADENZA ISCRIZIONI: 30 GIUGNO 2000**

#### Direttori

A. Deriu, Dip. di Fisica, Università di Parma – M. Zoppi, Consiglio Nazionale delle Ricerche, IEQ, Firenze

#### Segreteria Organizzativa

G. lanni, Gruppo Nazionale Struttura della Materia del CNR, Roma

#### Informazioni generali e Modulo per l'iscrizione

- a. A partire da questa edizione la Scuola viene intitolata alla memoria del Prof. Francesco Paolo Ricci che ne era stato il promotore ed aveva sostenuto questa iniziativa fin dalla sua prima edizione nel 1981.
- b. La domanda di iscrizione deve essere fatta compilando il modulo di partecipazione reperibile presso il sito Web della Scuola.
- Oltre alle lezioni ufficiali la Scuola prevede seminari ed esercitazioni pratiche che completeranno il programma didattico.
- d. Il numero degli studenti è limitato a 30. Persone con provata esperienza nel campo potranno essere ammesse come osservatori. Dietro loro richiesta la segreteria potrà occuparsi della loro sistemazione alberghiera.
- e. L'accettazione delle iscrizioni e l'eventuale contributo verranno comunicati via e-mail entro il 31.07.2000.
- f. È disponibile un certo numero di borse per coprire il costo della partecipazione.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Scuola: Grazia lanni - GNSM, Viale dell'Università 11, 00185 Roma Tel.: 06 4452258 - Fax: 06 4941159 - e-mail: ianni@axcasp.caspur.it Sito Web: http://SISN.unime.it/scuola\_neutroni.html

A 11	-			
Spettroscop	12	Moutropica	"ED	Dicci"
	Ia	Neuronica	F- F-	DILL

Diffusione Anelastica dei Neutroni

Hotel Capo d'Orso - Località Cala Capra - Palau (SS)

23 settembre - 3 ottobre 2000 MODULO D'ISCRIZIONE

Nome		Cogno	me	
Posizione at	ttualmente	ricoperta	(laureando,	dottorando
borsista,)				
Affiliazione				
Land College				

Telefono Fax

La scheda va inviata entro il 30 giugno 2000 a: Grazia Ianni, GNSM, Viale dell'Università 11, 00185 Roma

Grazia lanni, GNSM, Viale dell'Università 11, 00185 Roma e-mail: ianni@axcasp.caspur.it • fax 06 4941159







#### EDITORIALE C. Andreani

### RASSEGNA SCIENTIFICA

Insight into Biosciences from Synchrotron Radiation A. Congiu Castellano

Neutron Diffraction for Residual Stress Measurements: Applications to Materials and Components for Automotive Technology F. Fiori

Critical Behaviour of a Fluid Mixture Confined in a Porous Glass Investigated Through SANS F. Formisano and J. Teixeira

Nano-Scale Spectroscopy and its Applications to Semiconductors S. Heun and G. Salviati

Chain Deformation in Unfilled and Filled Polymer networks: a SAS Approach W. Pyckhout-Hintzen et al.

Stress-Texture Studies in Thin Films and Coatings by Synchrotron Radiation XRD and Neutron Diffraction *P. Scardi* 

VARIE
SCUOLE E CONVEGNI
CALENDARIO
SCADENZE

**FACILITIES**